Inhalt

	milait	Seite
Europä	iisches Vorwort	
1	Anwendungsbereich	
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe, Abkürzungen und Vereinbarungen	9
3.1	Begriffe	
3.2	Abkürzungen	12
3.3	Vereinbarungen	
4	Grundprinzipien	12
5	Beschreibung des ICIM-CI-Modells	12
5.1	Allgemeines	12
5.2	Beschreibung des PDN	14
5.3	Beschreibung der IBC	16
5.4	Beschreibung des IB	16
6	CIML-Format	17
6.1	Allgemeines	17
6.2	CIML-Struktur	18
6.3	Globale Schlüsselwörter	19
6.4	Header-Abschnitt	19
6.5	Definition der Anschlussleitungen	20
6.6	SPICE-Makromodelle	21
6.7	Abschnitt mit den Gültigkeitsbedingungen	23
6.7.1	Allgemeines	23
6.7.2	Attributdefinitionen	24
6.8	PDN	25
6.8.1	Allgemeines	25
6.8.2	Attributdefinitionen	26
6.8.3	PDN für einen massebezogenen Eingang oder Ausgang	29
6.8.4	PDN für einen Differenzeingang	37
6.8.5	Beschreibung von Mehr-Port-PDN	40
6.9	IBC	41
6.9.1	Allgemeines	41
6.9.2	Attributdefinitionen	41
6.10	IB	43
6.10.1	Allgemeines	43
6.10.2	Attributdefinitionen	43
6.10.3	Beschreibung	49
7	Herleitung	51

		Seite
7.1	Allgemeines	
7.2	Randbedingungen für die Herleitung der Umweltbedingungen	
7.3	Herleitung des PDN	
7.3.1	Allgemeines	
7.3.2	Messung der S-/Z-/Y-Parameter	
7.3.3	RFIP-Verfahren	52
7.4	Herleitung von IB	52
7.4.1	Allgemeines	52
7.4.2	Verfahren der direkten HF-Leistungseinspeisung	52
7.4.3	Verfahren der HF-Einspeisung mit Einkoppelzange	55
7.4.4	IB-Wertetabelle	56
7.5	IBC	56
8	Nachweis der ICIM-CI-Hypothesen	56
8.1	Allgemeines	56
8.2	Linearität	57
8.3	Störfestigkeitskriterien in Abhängigkeit von der übertragenen Leistung	58
9	Nutzung des Modells	59
Anhan	g A (normativ) Vorläufige Definitionen für die XML-Darstellung	61
A.1	XML-Grundlagen	61
A.1.1	XML-Vereinbarung	61
A.1.2	Grundelemente	61
A.1.3	Wurzelelement	61
A.1.4	Kommentare	62
A.1.5	Zeilenabschluss	62
A.1.6	Hierarchie der Elemente	62
A.1.7	Attribute der Elemente	62
A.2	Anforderungen an Schlüsselwörter	62
A.2.1	Allgemeines	62
A.2.2	Zeichen für Schlüsselwörter	63
A.2.3	Syntax für Schlüsselwörter	63
A.2.4	Dateistruktur	63
A.2.5	Werte	65
Anhan	g B (informativ) Beispiel für ein ICIM-CI mit einer störenden Last	67
Anhan	g C (informativ) Umrechnungen zwischen Parametertypen	68
C.1	Allgemeines	68
C.2	Massebezogener Eingang oder Ausgang	
C.3	Differenzeingang oder -ausgang	
Anhan	ng D (informativ) Beispiel für ein ICIM-CI-Makromodell im CIML-Format	
	g E (normativ) Gültige Schlüsselwörter für CIML und deren Nutzung	

		Seite
E.1	Schlüsselwörter für Root element	78
E.2	Schlüsselwörter für den Datei-Header	78
E.3	Schlüsselwörter für den Abschnitt Validity	80
E.4	Globale Schlüsselwörter	80
E.5	Schlüsselwort Lead	81
E.6	Attribute für den Abschnitt Lead_definitons	81
E.7	Attribute für den Abschnitt Macromodels	81
E.8	Schlüsselwörter für den Abschnitt Pdn	82
E.8.1	Schlüsselwörter für das Element <i>Lead</i>	82
E.8.2	Schlüsselwörter für den Abschnitt Netlist	84
E.9	Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>lbc</i>	84
E.9.1	Schlüsselwörter für das Element <i>Lead</i>	84
E.9.2	Schlüsselwörter für den Abschnitt Netlist	86
E.10	Schlüsselwörter für den Abschnitt Ib	86
E.10.1	Schlüsselwörter für das Element <i>Lead</i>	86
E.10.2	Schlüsselwörter für den Abschnitt Max_power_level	87
E.10.3	Schlüsselwörter für den Abschnitt Voltage	88
E.10.4	Schlüsselwörter für den Abschnitt Current	89
E.10.5	Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Power</i>	90
E.10.6	Schlüsselwörter für den Abschnitt Test_criteria	91
Anhan	g F (informativ) PDN-Impedanzmessverfahren mit einem Vektor-Netzwerkanalysator	92
F.1	Allgemeines	92
F.2	Übliches 1-Port-Verfahren	92
F.3	2-Port-Verfahren für die niederohmige Messung	92
F.4	2-Port-Verfahren für die hochohmige Messung	93
Anhan	g G (informativ) Beschreibung des RFIP-Messverfahrens	94
G.1	Allgemeines	94
G.2	Ermittlung der Störfestigkeitsparameter	94
Anhanç	g H (informativ) Simulation der Störfestigkeit mit dem ICIM auf der Basis einer Prüfung, die auf dem Bestehen/Nicht-Bestehen beruht	96
H.1	ICIM-CI-Makromodell einer integrierten Spannungsreglerschaltung	96
H.1.1	Allgemeines	96
H.1.2	Herleitung des PDN	96
H.1.3	Herleitung von IB	96
H.1.4	SPICE-kompatibles Makromodell	97
H.2	Simulation auf der Anwendungsebene und Ausfallvorhersage	97
Anhanç	g I (informativ) Simulation der Störfestigkeit mit dem ICIM auf der Basis einer Prüfung, die nicht auf dem Bestehen/Nicht-Bestehen beruht	99
Literatu	ırhinweise	101

	Seite
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	102
Bilder	
Bild 1 – Beispiel für die Modellstruktur des ICIM-CI	13
Bild 2 – Beispiel für ein ICIM-CI einer elektronischen Leiterplatte	14
Bild 3 – Beispiel für ein IBC-Netzwerk	16
Bild 4 – Darstellung des ICIM-CI mit verschiedenen Blöcken	16
Bild 5 – CIML-Vererbungshierarchie	18
Bild 6 – Beispiel für eine Netzlistendatei zur Definition eines Teilstromkreises	23
Bild 7 – Elektrischer Schaltplan des PDN	30
Bild 8 – Als 1-Port-Blackbox dargestelltes PDN	30
Bild 9 – PDN-Darstellung als S-Parameter im Touchstone-Format	33
Bild 10 – PDN-Darstellung als 2-Port-S-Parameter im Touchstone-Format	33
Bild 11 – Beispielstruktur für die Definition des PDN anhand von Schaltkreiselementen	35
Bild 12 – Beispiel für die Definition einer Netzliste des Hauptstromkreises eines massebezogenen PDN	35
Bild 13 – Beispiel für die Netzliste eines massebezogenen PDN mit den Definitionen von Teilstromkreis und Hauptstromkreis	36
Bild 14 – Schaltplan für einen Differenzeingang	37
Bild 15 – PDN-Darstellung als 2-Port-Blackbox	38
Bild 16 – PDN-Datenformat für einen Differenzeingang oder -ausgang	38
Bild 17 – Beispiel für die Differenzeingänge eines Operationsverstärkers	39
Bild 18 – ICIM-CI für den Schaltkreis 74HC08	40
Bild 19 – Beispiel für eine IB-Datei, die mit einer DPI-Messung ermittelt wurde	50
Bild 20 – Prüfaufbau für das DPI-Verfahren zur Messung der Störfestigkeit nach den Festlegungen in IEC 62132-4	53
Bild 21 – Prinzip der DPI mit einem einzelnen Anschlussstift und mit mehreren Anschlussstiften	53
Bild 22 – Elektrische Darstellung des DPI-Prüfaufbaus	54
Bild 23 – Prüfaufbau für das RFIP-Messverfahren, abgeleitet aus dem DPI-Verfahren	55
Bild 24 – Beispiel für einen Aufbau zur Veranschaulichung der ICIM-CI-Hypothesen	57
Bild 25 – Beispiel für den Gültigkeitsnachweis der Linearitätsannahme	58
Bild 26 – Beispiel für den Nachweis des Kriteriums der übertragenen Leistung	59
Bild 27 – Nutzung des ICIM-CI-Makromodells für die Simulation	59
Bild A.1 – Mehrere XML-(CIML-)Dateien	64
Bild A.2 – XML-Dateien mit Datendateien (*.dat)	64
Bild A.3 – XML-Dateien mit zusätzlichen Dateien	65
Bild B.1 – Anwendung der ICIM-CI-Beschreibung auf eine Oszillatorstufe zur Herleitung des IB	67
Bild C.1 – Massebezogener DI	68
Bild C.2 – Differenz-DI	69
Bild C.3 – 2-Port-Darstellung eines Differenz-DI	69

	Seite
Bild C.4 – Simulation der Gleichtakteinspeisung in einen Differenz-DI für DPI-Messungen	
Bild C.5 – Gleichtakt-Ersatzeingangsimpedanz eines Differenz-DI	71
Bild C.6 – Bestimmung der übertragenen Leistung für einen Differenz-DI	71
Bild D.1 – Prüfaufbau für einen LIN-Transceiver	73
Bild D.2 – PDN-Daten im Touchstone-Format (s2p), Daten wurden mit einem VNA gemessen	75
Bild D.3 – PDN-Daten der Anschlussleitungen 6 (LIN) und 7 (VCC)	76
Bild D.4 – IB-Daten im ASCII-Format (.txt), Daten wurden mit dem DPI-Verfahren gemessen – Einspeisung am VCC-Anschlussstift	76
Bild D.5 – IB-Daten für die Einspeisung am VCC-Anschlussstift	77
Bild F.1 – Übliche 1-Port-Messung der S-Parameter	92
Bild F.2 – 2-Port-Verfahren für die niederohmige Messung	92
Bild F.3 – 2-Port-Verfahren für die hochohmige Messung	93
Bild G.1 – Prüfaufbau für das RFIP-Messverfahren, abgeleitet aus dem DPI-Verfahren	94
Bild G.2 – Prinzip der RFIP-Messung	94
Bild H.1 – Elektrischer Schaltplan für die Herleitung des ICIM-CI eines Spannungsreglers	96
Bild H.2 – Herleitung des ICIM-CI für das Beispiel des Spannungsreglers	97
Bild H.3 – Beispiel für ein SPICE-kompatibles ICIM-CI-Makromodell des Spannungsreglers	97
Bild H.4 – Beispiel für eine Simulation eines ICIM-CI eines Spannungsreglers auf der Leiterplattenebene mit einem Leiterplattenmodell und anderen Komponenten einschließlich parasitärer Elemente	98
Bild H.5 – Störleistung, die erforderlich ist, um mit einem 10-nF-Filter einen Fehler zu erzeugen, als Funktion der Frequenz	98
Bild I.1 – Beispiel einer IB-Datei für ein gegebenes Fehlerkriterium	99
Bild I.2 – Vergleich der simulierten übertragenen Leistung mit dem gemessenen Störfestigkeitsverhalten	100
Tabellen	
Tabelle 1 – Attribute des Schlüsselworts Lead im Abschnitt Lead_definitions	20
Tabelle 2 – Kompatibilität zwischen den Feldern Mode und Type für eine korrekte CIML-Notation	21
Tabelle 3 – Definition von Subckt	21
Tabelle 4 – Definition des Abschnitts Validity	23
Tabelle 5 – Definition des Schlüsselworts <i>Lead</i> für den Abschnitt <i>Pdn</i>	26
Tabelle 6 – Gültige Datenformate und ihre Standardeinheiten im Abschnitt Pdn	28
Tabelle 7 – Gültige Dateierweiterung im Abschnitt <i>Pdn</i>	29
Tabelle 8 – Gültige Felder des Schlüsselworts <i>Lead</i> für ein massebezogenes PDN	31
Tabelle 9 – Definition von <i>Netlist</i>	34
Tabelle 10 – Gültige Felder des Schlüsselworts <i>Lead</i> für ein Differenz-PDN	38
Tabelle 11 – Unterschiede zwischen den Feldern in den Abschnitten <i>Pdn</i> und <i>lbc</i>	42
Tabelle 12 – Gültige Felder des Schlüsselworts Lead für die Definition des IBC	42
Tabelle 13 – Definition des Schlüsselworts <i>Lead</i> im Abschnitt <i>lb</i>	43
Tabelle 14 – Definition von <i>Max_power_level</i>	44

	Seite
Tabelle 15 – Definition von <i>Voltage</i> , <i>Current</i> und <i>Power</i>	
Tabelle 16 – Definition von <i>Test_criteria</i>	46
Tabelle 17 – Standardwerte für die Tags <i>Unit_voltage</i> , <i>Unit_current</i> und <i>Unit_power</i> als Funktion des Datenformats	49
Tabelle 18 – Gültige Dateierweiterungen im Abschnitt <i>lb</i>	49
Tabelle 19 – Beispiel für eine Tabelle mit Bestanden/Nicht-Bestanden-Kriterien für das IB	56
Tabelle A.1 – Gültige logarithmische Einheiten	66
Tabelle C.1 – Umrechnung massebezogener Parameter	69
Tabelle C.2 – Umrechnung von Differenzparametern	70
Tabelle C.3 – Berechnung der Leistung	72
Tabelle E.1 – Schlüsselwörter für <i>Root element</i>	78
Tabelle E.2 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Header</i>	79
Tabelle E.3 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Validity</i>	80
Tabelle E.4 – Globale Schlüsselwörter	80
Tabelle E.5 – Definition des Elements <i>Lead</i>	81
Tabelle E.6 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Lead_definitions</i>	81
Tabelle E.7 – Schlüsselwörter für den Abschnitt Macromodels	81
Tabelle E.8 – Schlüsselwörter für das Element <i>Lead</i> im Abschnitt <i>Pdn</i>	82
Tabelle E.9 – Schlüsselwörter für den Abschnitt Netlist	84
Tabelle E.10 – Schlüsselwörter für das Element <i>Lead</i> im Abschnitt <i>lbc</i>	84
Tabelle E.11 – Schlüsselwörter für das Element <i>Lead</i> im Abschnitt <i>lb</i>	86
Tabelle E.12 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Max_power_level</i>	87
Tabelle E.13 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Voltage</i>	88
Tabelle E.14 – Schlüsselwörter für den Abschnitt Current	89
Tabelle E.15 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Power</i>	90
Tabelle F.16 – Schlüsselwörter für den Abschnitt <i>Test criteria</i>	91